

FICHA CATALOGRÁFICA

Preto, André de Oliveira

Caracterização de materiais por interferometria holográfica em cristais fotorrefrativos utilizando lasers de diodo multimodo / A.O. Preto. -- São Paulo, 2009.

p. 89

Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos.

1. Holografia 2. Interferometria 3. Laser I. Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos II. t.